

## PROGRAMME

### Jeudi 15 juin 2023

08:30 **Accueil des participants (inscrits à la formation)**

09:00 Formation (pour les participants inscrits)

*Découverte des techniques de caractérisations physicochimiques des surfaces et interfaces*  
**(AFM, FIB, PO3D, SEM, TEM, TOF-SIMS, XPS)**

10:30 **Pause-café**

11:00 Formation (pour les participants inscrits)

*Découverte des techniques de caractérisations physicochimiques des surfaces et interfaces*  
**(AFM, FIB, PO3D, SEM, TEM, TOF-SIMS, XPS)**

12:30 **Pause déjeuner**

13:30 **Introduction de bienvenue**

### **SESSION 1 : Défis analytiques**

13:45 SIMS et couplage LC(HR)/MS, outils complémentaires à l'analyse de produits de dégradation dans des produits cosmétiques solides

*G. Provot\*, A. Cosette, E. Juliana, L. Gireaud*  
**L'OREAL**

14:10 Développement d'un capteur OEM pour la détection en temps réel de particules biologiques dans l'air

*L. Debard\*, A. Dumas*

**TERA ENVIRONNEMENT**

14:35 NanoMesureFrance : un point d'entrée unique pour structurer la filière industrielle des nanomatériaux autour de données fiabilisée

*FX. Ouf\*, G. Favre*

**LNE**

15:00 Résultats d'essais thermiques et thermomécaniques : observation en MEB in-situ

*A. Candeias*

**NEWTEC**

15:25 **Pause-Café**

## PROGRAMME

**...Jeudi 15 juin 2023**

### **SESSION 2 : Couches minces**

- 15:45 Optimisation de la distance de masquage par une caractérisation fine du débord de dépôt  
*B. Letourneur\*, A. Garnier*  
**SAFRAN**
- 16:10 Caractérisation des surfaces et des interfaces de cellules solaires en couches minces  
*C. Chappaz\*, O. Gagliano*  
**GARMIN**
- 16:35 Dépôts multicouches déposés par plasma sur substrats polymères et PCB : caractérisations physico-chimiques et fonctionnelles (adhésion, release, anti-corrosion)  
*J. Jellid\*, N. VandenCastele, J. Viard, E. Gat, J. Vallade, S. Van Marcke*  
**CPI**
- 17:00 Assemblage et lamination de cartes bancaires : optimisation de l'adhésion aux interfaces des couches et amélioration du visuel  
*B. Baudouin*  
**SPS INGROUPE**
- 17:25 Analyses de couches métalliques sur un micro-chip  
*B. Bortolotti\*, A. Garnier*  
**ST MICROELECTRONICS**
- 17:50 **Fin de la 1<sup>ère</sup> journée**
- 18:30 **Dîner surprise à la BASTIDE DE FAVE**

## PROGRAMME

### Vendredi 16 juin 2023

#### SESSION 3 : Innovation équipement

08:30 **Ouverture de la 2<sup>ème</sup> journée**

08:35 Caractérisation simultanée des propriétés mécaniques et chimiques de composants métalliques par microscopie micro-onde

*M. Garnier\*, E. Lesniewska, ...*

**LICB**

09:00 SEM & FIB (titre final à venir)

*D. Barresi*

**TESCAN**

09:25 Profilomètre interférométrique (titre final à venir)

*M. Febvre*

**BRUKER**

09:50 How to identify the optimal plasma treatment length for different surfaces

*V. Schloupt*

**DATAPHYSICS**

10:15 **Pause-Café**

10:35 Advances in automated XPS analysis – from data to answers

*C. Blomfield\*, S. Hutton, AJ. Roberts, C. Moffitt, JDP. Counsell, SJ. Coultts, K. Good, K. Macak*

**KRATOS**

11:00 Recent developments and applications of TOF-SIMS and LEIS for surface analysis

*M. Kleine-Boymann\*, T. Therhorst*

**IONTOF**

11:25 TENSOR: new STEM

*D. Barresi*

**TESCAN**

11:50 Préparation de lames minces pour MET et nettoyage Post FIB basse tension avec le PIPS

*L. Legras*

**AMETEK**

12:15 New dimensions to micro-CT imaging for industrial applications

*J. Dewanckele\*, B. Desmet*

**XRE**

12:40 **Pause déjeuner**

## PROGRAMME

...Vendredi 16 juin 2023

### SESSION 4 : Contamination

- 14:00 Analyse multi-échelle d'une anomalie en surface d'une pièce métallique après usinage  
*T. Caparros*  
**AIRBUS HELICOPTERS**
- 14:25 USE CASE WITH NANOSPACE: How an analytical FIB-SEM-SIMS tool helps to understand contaminations on a wafer surface  
*J. Silvent*  
**ORSAY PHYSICS**
- 14:50 Une multiplicité d'agents de nettoyage, comment s'assurer d'un état de propreté conforme ?  
*L. Panaiva*  
**POLYMEX**
- 15:15 Conclusion
- 15:30 **Fin du Workshop**

\*\*\*\*\*

### EXPOSANTS/SPONSORS



### PARTENAIRES FONDATEURS



### PARTENAIRE

